

# 材料分析ソリューションサービスのご紹介

当社がご提供する「材料分析ソリューションサービス」をご紹介します。

各種材料・デバイスの表面分析及び、微細構造解析などの高度な分析サービスをもって、お客様の品質向上と問題解決に貢献いたします。

## 微細構造解析 (STEM-EDX, FIB-SIM, SEM)

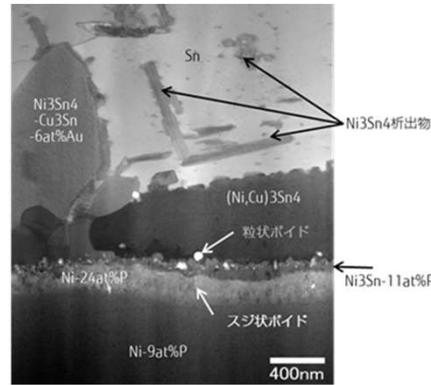
・高分解能TEM観察とSTEM-EDX分析を組み合わせると材料・デバイスの微細構造を分析します。



FIB-SIM



STEM-EDX



はんだ接合部のSEM観察

※ パートナー企業：ユーロフィンFQL株式会社



We always try to create the highest value with originality and creativity.

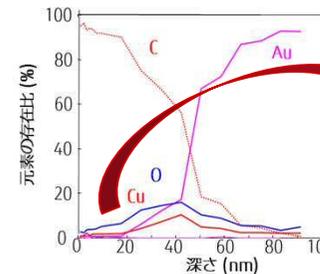
## 表面分析 (AES, XPS)



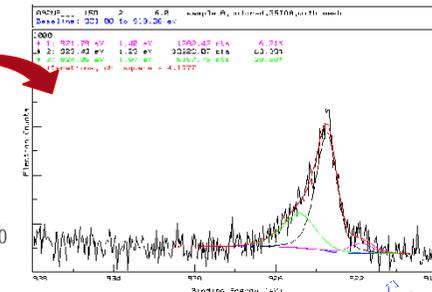
・材料の最表面(原子数層)の状態を把握、表面汚染や酸化などの要因を原子・分子レベルで究明します。



μ XPS



電極変色部の  
AES深さ分析



XPS分析(ナロースペクトル)

【本サービスに関するお問合せ先】

日邦産業株式会社 商事本部

Email : [nippo9913@nip.co.jp](mailto:nippo9913@nip.co.jp)